

ひとわざ(一技)名: 世界初ナノレベルのキズ欠陥を広視野高速で検出

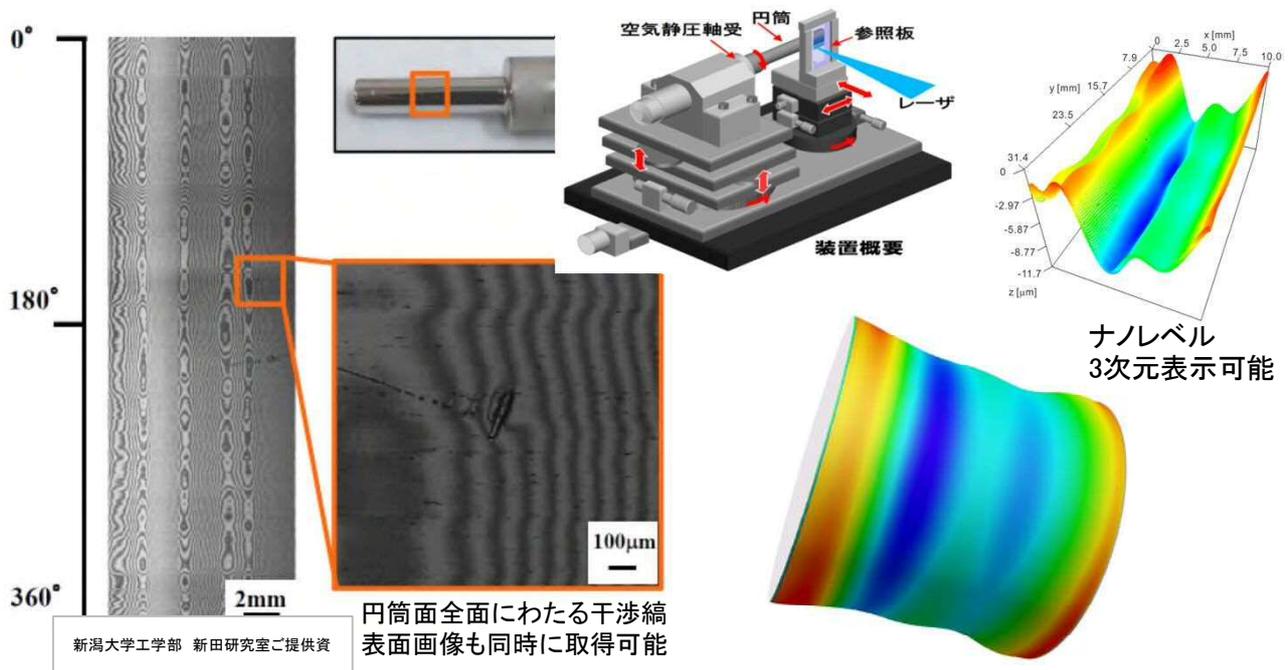
1. 概要(200字目安)

3D形状計測できるレーザ走査イメージャ

- ①干渉タイプを用いると50nmの変化形状測定が可能です。
- ②キズや深い穴の欠陥も検出可能です。
- ③円筒面の形状計測やは画像取得も可能です。

画像ソフトで欠陥検出可能です。

写真・図(要点説明)



2. 企業概況

会社名	株式会社 オプセル		代表者名	小俣 公夫			
			窓口担当	井上 英文			
事業内容	レーザ走査をコア技術とした光学機器商品		URL	http://www.opcell.co.jp			
主要製品	レーザ走査イメージャ、レーザラスタ走査直接描画装置、特注レンズ設計製作(fθテレセン)						
住所	〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-318 みづほビル3F						
電話/FAX	048-607-8888 / 048-607-8889		E-mail	support@opcell.co.jp			
資本金(百万円)	15	設立年月日	平成13年12月	売上(百万円)	100	従業員数	6

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他

- ①今までに申出された特許件数は25件。レーザ走査イメージャ、直描画装置に使用されている。
- ②レーザ走査イメージャの光学ヘッド部、光学ユニットを提供することにより、今まで出来なかった検査装置の開発が期待される。
- ③透明フィルム、サファイヤウエハ、セラミック、ガラス、蒸着膜、樹脂等の傷欠陥検査に実績あり。新技術として干渉縞を利用してナノレベルの測定が出来る装置の開発を行っている。